島根大学地球資源環境学研究報告 17, 49~56 ページ (1998 年 12 月) Geoscience Rept. Shimane Univ., 17, p.49~56 (1998)

# レーザー回折式粒度分布測定装置の使用法と分析結果の特徴

中山 勝博\*・草野 高志\*\*

## Guide for a laser diffraction particle size analyzer, and its data characteristics

Katsuhiro Nakayama\* and Takashi Kusano\*\*

#### Abstract

This paper describes the introductive guide for a laser diffraction particle size analyzer (SALD-3000S; Shimazu Co., Ltd.), and discuss the comparison of data obtained from different analytical methods and analyzers. SALD-3000S is abailable for any sand and mud material, and its measurement range covers from 0.08 to 3000  $\mu$ m. SALD-3000S has several advantages such as simple suitability of a laser axis, and real-time modulation of sample bulk concentration, in comparison with previous laser diffraction particle size analyzers. Measurements of well-known diameter samples coincide with true values of diameter. Measurements of sand-mud samples with three different grain analyzers of a settling-tube grain sizer, the previous laser diffraction particle size analyzer (measurement range: 0.1–192  $\mu$ m), and SALD-3000S, suggests that SALD-3000S provides the most precise and is the simplest to measure.

Key words: laser diffraction particle size analyzer, SALD-3000S, grain size distribution

## はじめに

堆積物を調べるにあたり,構成粒子の粒度分析は最も 基本的かつ重要な事項である. 島根大学総合理工学部地 球資源環境学科には,これまでに粒度分析用装置・器具 として,振篩分析装置と各種ふるい,エメリー管,ピ ペット法用のメスシリンダーなどの器具、沈降管式粒度 分析装置(正豊製作所 MT-S 150;伊勢屋, 1985;田村· 中山, 1993), それに 0.1~192 µm を測定範囲とする レーザー回折式粒度(分布)分析装置が導入されている. しかし、これらの装置では、 泥質砂のような粒径分布の 広い試料や火山ガラスと軽石といった粒子密度の大きく 異なる火山砕屑物試料については、別々の装置で測定し た結果をつなぎ合せて1つの分析結果とするなどの作業 が必要であった.これらを行うには、測定時間にかなり の時間を要する上、そのつなぎ合せについて、測定精度 に直接影響するような様々な問題が存在した(Komar and Cui, 1984; 岸·公文, 1993).

これらの問題を根本的に解決するには,測定範囲が大 きく,粒子密度の規制を受けない粒度分布分析装置の導 入が必要であった.幸い,本年,測定範囲が0.08~3000 μm (3 mm) までのレーザー回折式粒度(分布)分析装置(島津製作所 SALD-3000S)を教室に導入することができた.これによって,泥流堆積物や火山砕屑物の粒度分析を飛躍的に正確かつ短時間に行うことが可能となった.

本報告では、SALD-3000Sの基本的な操作手順、それ に同一試料をSALD-3000Sと既存装置で測定した結果 の比較について述べる.なお、本装置は再堆積した火山 砕屑物の運搬・堆積機構を定量的に解析するために導入 されたものであり、発泡のよい軽石など粒子密度が1.0 g/cm<sup>3</sup>未満の粒子の測定にも対応できるよう乾式ユニッ トも導入した.本教室には、(既存のものも含めて)湿 式・乾式の粒子密度測定装置も入っている.火山砕屑物 を対象にした乾式と湿式での粒子密度・粒径分布測定結 果とその特性については別稿で行う予定である.

## レーザー回折式粒度分析装置(SALD-3000S)

#### 1.原理

レーザー回折式粒度分析装置の一般的な事項について は、公文・志岐(1998)に説明されている.レーザー回 折式粒度分析装置は、「粒子はその大きさに応じて、一 定の角度で光を回折する」というフラウンフォーファー 回折と「波が、その波長に比べてあまり大きくない粒子 に当たると粒子を中心として周囲に広がる散乱光が生じ る」というミー散乱に基づいた粒度分布の測定装置であ

<sup>\*</sup> 島根大学総合理学部地球資源環境学科 Department of Geoscience, Shimane University, Matsue 690-8504, Japan

<sup>\*\*</sup> 島根大学大学院理学研究科地質学専攻 Department of Geoscience, Shimane University, Matsue 690-8504, Japan

る.実際には、水などの媒体内に測定試料を投入し、+ 分に攪拌された状態で、レーザーを透過させる試料セル に試料を送りこみ(ポンプで循環させ)、レーザー光の 回折・散乱をセンサーで読み込み粒度分布に換算すると いうことになる.ここで、注意しなければならないこと は、ここで測定される粒径は、基本的に粒子の長軸とい うことになる.また、基本的に粒子体積頻度で測定される.

SALD-3000Sの場合、試料セルを通過する試料に波長 690 nm の半導体レーザーを透過させ、その回折・散乱 光の位置と強度を多層構造のセンサ(実際には76素子 の翼型前方センサ,1素子の側方センサ,2素子の後方セ ンサがある) で受信し, 頻度分布に置き換えて表示され る. Agrawal et al. (1991) は, この測定方法に関して, 特に細粒部の信頼性に問題を指摘している.しかし, メーカー側も問題解決に対応できる技術開発と基礎資料 を十分に得ている.本教室に既存のレーザー回折式 対度 分析装置も含め従来のレーザー回折式粒度分析装置で は、測定粒子径の上限は 500 µm 程度であったが、SALD -3000Sでは、収束レンズから前方センサまでの距離を 十分とるなどして大粒径による微小回折も捕らえられる ようにしている.実際, SALD-3000S が開発されるまで の段階で最も大きな粒径まで測定できた島津製 SALD-2000 (測定範囲: 0.03~2000 µm)の横幅が 71 cm であっ たのに対し、SALD-3000S では横幅 95 cm となってお り、その幅の拡大は試料セル前方の収束レンズから前方 センサ部までの距離を長くしたためと考えられる.

### 2. 操作方法

SALD-3000S は、レーザーやセンサの入った本体部、 サンプルを攪拌し本体部に送り込んだり排出したりする サンプラ部、それにこれらを制御し演算を行うパソコン 部から構成される(第1図).この他、オプションとし ての乾式ユニットや集塵機もある.パソコンには基本的 に測定・データ表示・データ管理などの標準機能の入っ た「Wing-1」がインストールされていればよい.他に 多元処理機能の付いた「Wing-2」、統計処理や時系列処 理といった拡張機能の入った「Wing-3」もある.さら に乾式ユニットを使用する場合は「WingSALD-3000S (ドライ測定用)」をインストールしなければならない. これらのソフトはウインドウズ 95 上での正常動作が保 証されている.

標準的な測定手順は次のようにまとめられる.メー カーから提供されている標準操作の流れ図を第2図に示 す.

 本体部の電源を入れ、サンプラ部の操作パネル(第 1図3参照)上のスイッチが全てOFFされていること



第1図 レーザー回折式粒度分析装置 (SALD-3000 S).1:全景.2:本体部右カバーを開いた様子,光 軸調整ねじが2本認められる.3:サンプラ部の拡 大写真.サンプラ部操作パネルには,左から順に スターラ,超音波洗浄機,ポンプのスイッチと速 度調節ツマミが認められる.分散漕の中央奥に見 えている白いものが,超音波洗浄機の作動の可否 を判断するフロート.

を確認した上でサンプラ部の電源を入れる.

② パソコンを起動し、「Wing-1」を開く.

③ 第2図では、ここで「マニュアル測定」を選択と なっているが、動作環境、特に光軸調整が正常であるこ とを確認するため「診断・調整」を選択する、「マニュ



第2図 標準的な操作手順(取扱説明書による).

アル測定」を押しても「診断・調整」を押してもパソコ ンと本体部との通信が始まる.

④ 「診断・調整」で光軸(位置センサデータ)を確認 する.許容範囲内であれば問題ない.第3図に「診断・ 調整」における画面表示(実際にはそれをプリントアウ トしたもの)の例を示す.ここで光軸調整は、本体部の 右カバーを開くと調節ねじがあり、それを回転させるこ とによって可能である(第1図2).サンプリング時間 の関係で数秒以下のタイムラグがあるものの、ほぼリア ルタイムで光軸調整が可能である.これは、教室に既設 のレーザー回折式粒度分析装置の光軸調整が基本的に ユーザーでは行えなかったこと(実際には診断用のフ ロッピをメーカーから譲り受ければ、時間はかかるもの のユーザーでも調整可能)と比較して、大変に容易であ るといえる.

⑤ 「マニュアル測定」を選択し、サンプル番号などを 入力する.すると光強度分布データが表示される.



第3図 「診断・調整」メニュー.光軸は,下の2 つの正方形にモニタされる.本体部の光軸調整ね じを回すとそれに対応して左の正方形の中の網掛 け部分,そして右の正方形内の縦線と横線が変化 し,光軸の調整を行うことになる.

		島津 SALE	)–3000S (SAL	D-3000-WJA	2:V1.00DX)	
(ファイル 名)tide01 (サンプル ID)tide01      (サンプル #)01 (測定年月日 )98/10/03     (測定 時間 )09:47:34						
屈折	f率=1.70 - 0.20i	/ディアン径: 2	5.736 平均值 :	17.564 10	0.0%D : 1.161	SUA" # : 0
変搏	<b>↓</b> 〒−プル: 0	モート径: 39	9.9/3 標準偏差:	0.760 50 90	0.0%D : 25.736 0.0%D : 131.462	分布関数:無 Dシフト : 0
	0 3 (%) q 3 (%) 100 90 70					
0.1 0.5 1 5 10 50 100 500 1000 5000 粒子径(μm)						
	<u>粒子径 積算値</u> x(μm) Q3(%)	差分値 q3 (%)	<b>粒子径 積算値</b> x(μm) Q3(%)	i 差分值 q3(%)	<u>粒子径 積</u> 算 x(μm) Q3(	算 <mark>值 差分值</mark> <sup>[</sup> %) q3(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	3000.000         100.000           2430.192         100.000           1968.611         100.000           1594.701         100.000           1291.810         100.000           1436.449         100.000           847.691         100.000           566.258         100.000           556.258         100.000           365.019         100.000           295.688         99.922           239.527         99.411           194.032         97.704           157.178         94.63           127.324         89.255           103.141         84.277	$\begin{array}{c cccc} 0.\ 000 & 1 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 0.\ 000 & 2 \\ 1.\ 706 & 3 \\ 3.\ 541 & 3 \\ 4.\ 909 & 3 \\ 4.\ 978 & 3 \\ 4.\ 367 & 3 \end{array}$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9       4. 211         9       4. 842         7       5. 675         2       6. 061         2       5. 909         3       5. 442         1       4. 872         8       4. 263         5       3. 707         8       3. 263         5       3. 707         8       3. 263         5       3. 707         8       3. 263         5       2. 889         9       2. 641         7       2. 889         9       2. 641         1       1. 987         4       1. 796	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$

第4図 測定結果の例.

⑥ サンプラ部の分散漕に媒体(ほとんどの場合は水) を入れる.分散漕にはスターラとともに超音波洗浄作動の可否を判断する白いフロートがあるので、フロートが 全てつかるまで水を入れる(第1図3参照).

 ⑦ サンプラ部の操作パネルにおいて、ポンプ速度調節 ツマミを3以下のレベルにして(モーターに急激な負担 がかからないようにするため)、ポンプスイッチを入れ る.以下、ポンプやスターラのスイッチのON,OFFに 関しては、同じ理由で速度調節レベルを下げて操作する こと.

⑧ 数秒待ってからブランク測定を行う.ブランク領域内であれば、次の手順に入るが、そうでなければ⑪~⑬で述べる洗浄作業を行う.

⑨ 分散漕に試料(あらかじめ水で混濁液状にしたもの)を投入して測定を行う.ここで標準的な測定としては、1分間の超音波洗浄と10秒以上のスターラ攪拌が示

されている.しかし,試料によっては,それよりも長く 超音波洗浄を必要とする場合もある.超音波洗浄が粒径 分布にどのように影響しているかという例は,測定方法 は異なるものの公文(1990)などに示されている.また, 試料に応じてポンプ速度を上げる必要がある.マニュア ルには「比重が小さく粒子半径が数十 µm 程度であれば ポンプレベルは4~5」と示されている.分散剤につい ても,マニュアルに標準的なものが示されている.

本装置の特色の1つとして光強度分布がほぼリアルタ イムに表示され,適正な範囲であれば「測定領域」の文 字も表示されることが挙げられる.このため適正な濃度 の試料投与が大変に容易である.

「測定領域」となったところで「測定」を選択すると, 粒度分布測定が行われ第4図に示すようなシートが得ら れる(出力データには,いくつかのフォーム選択が可能 である.「第4図」はデフォルト状態で出力した).



第5図 複数の測定結果を比較した例.これは,島 根大学遺跡発掘調査に伴って露出した潮汐堆積物 の砂質部(3試料)と泥質部(4試料)を粒度分 析し,「Wing-3」を使って三次元表示させたもの. ファイル番号の1~7番は,厚さ10cm内に見ら れた砂質部と泥質部の試料を下位から順に並べた もの.「Wing-3」の三次元表示機能では,この三 次元ブロックの観察点を変えるとか,ファイルの 間隔を柱状間隔に合わせて変える,あるいは,表 示されている文字フォントを変えるといった表現 操作は不可能.基本的にこれを市販ドローソフト などに落としてから表現に手を加えなければなら ない.

⑩ 測定結果を表示させたら、プリントアウト、保存を 行い洗浄作業に入る.

① ポンプとスターラのスイッチを切り、サンプラ部の 左に付いているレバーを「排水側」に回し、ポンプス イッチを再び入れ排水する.排水後、ポンプスイッチを 切り、先のレバーを「送入側」に回し、分散漕に水を入 れ、ポンプスイッチを入れる.

 「マニュアル測定」を選択し、光強度分布データを 表示させる(ダミーのサンプル番号を入れればよい).
 光強度分布が⑨の状態に比較し、かなり下がっていることが確認できる。しかし、⑪の一回の洗浄で全てのセン サでゼロまで下がることは殆どない。

13 20の光強度分布データ(モニタリング)はそのままの状態にし、①の洗浄作業を3~4回行う.マニュアルでは10%前後の低レベルまで下がればよいとしているが、3~4回洗浄を行うと全てのセンサでほとんどがゼロまで下がる.この状態まで洗浄した後、CRT画面上の「キャンセル」を選択し、光強度分布のモニタを終了させる.

④ 測定試料が複数ある場合は、この状態から⑨にもどる.
⑤ ポンプスイッチを切り、パソコンを終了させ、サン

プラ電源を切り,本体部の電源を切る.これで測定および操作を終了する.

必要に応じて,「Wing-2」や「Wing-3」を使い統計 処理を行う(第5図に一例を示す).

#### 測定結果の比較

本装置の信頼性を確認するため既知粒径のガラスビー ズと粒径分布の広いことが予想できる潮汐堆積物とみら れる泥質砂~砂質泥(島根大学遺跡発掘調査で出現した 完新世のもの)について各装置間の測定結果比較を行った.

1.ガラスビーズ

標準ガラスビーズ(規格:2.25~2.50¢,0.210~0.250 mm)を沈降管式粒度分析装置と本装置とで各3回測定した.結果を第6図に示す.なお,このガラスビーズをSEM像で粒径の再チェックをしたところ,30粒子で粒径は0.202~0.264 mm,30粒子径の平均粒径(算術平均値)は0.233 mm であった.また,既設のレーザー回折式粒度分析装置は測定範囲が0.1~192 μm であり,このガラスビーズの測定はできなかった.

第6図からわかるように,SALD-3000Sでは,若干粗 粒に,沈降管式粒度分析装置では若干細粒にシフトした 値が得られた.しかし,いずれも10%未満のずれであ り,筆者らとしては,両者とも再現性が良好なよい測定 値であったと判断している.

#### 2. 泥質砂~砂質泥

ここで測定試料としてものは、潮流によるベッドロー



第6図 標準ガラスビーズの測定結果.上段の表は 各3回の測定結果を示したもの.下図は, SALD-3000Sの3回目の測定における粒径分布図.



第7図 (砂質)泥の測定結果.既設のレーザー回 折式粒度分析装置による測定値と本装置によるそ れとはよく一致している.上段は両装置を使って の各3回の測定結果.粒径の単位はµm.中段は, SALD-3000Sによる2回目の測定結果の粒度分 布.下段は,既設のレーザー回折式粒度分析装置 による2回目の測定結果の粒度分布.

ドとして形成されたとみられる泥質砂(露頭観察では極細粒砂と判断できる)と「なぎ」の時に浮遊・沈降によっ て形成されたとみられる(砂質)泥である.いずれの試料も分散在としてヘキサメタりん酸ナトリウム 0.2 wt% を加え,1分間の超音波洗浄をしたものを投与試料とした.以下は,同一試料における測定結果であるが,泥質 泥と砂質泥の積み重なりに従った粒度分析結果は第5図 に示している.

はじめに(砂質)泥を既設のレーザー回折式粒度分析 装置(測定範囲 0.1~192 µm)と本装置で各3回測定し た.測定結果を第7図に示す.真の値は不明であるが, 筆者らとしては再現性がよく機種差も少なく,両者とも よい測定結果を示していると判断する.なお,この試料 は細粒であるため,沈降管式粒度分析装置を使用するこ とはできなかった.

次に泥質砂の測定を行った.ちなみにこの種の試料は



第8図 泥質砂の測定結果.上段は3つの装置を 使っての各3回の測定結果(沈降管式粒度分析装 置では重量百分率をもとにモーメント法で解析し ており,それ以外は体積百分率をもとにしてい る).粒径の単位はµm.中段は,SALD-3000Sに よる1回目の測定結果の粒度分布.下段は,既設 のレーザー回折式粒度分析装置による1回目の測 定結果の粒度分布.

粒径分布幅が大きく,従来の測定装置で最も測定が難し かったものである.試料に対して測定装置が適当である かどうかの議論は別にして,この試料はSALD-3000S の他,既設のレーザー回折式粒度測定装置,そして,沈 降管式粒度測定装置を使用し,各装置で各3回の測定を 行った.結果を第8図に示す.測定結果を見ると,各測 定装置毎では3回の測定結果が比較的一定しているもの の,全体としてみたときの差異は大きい.すなわち,装 置毎に得られる結果は大きく異なる.この理由について は次の考察で述べる.

## 察

## 1.他の装置と比較しての SALD-3000S の特徴 ここで今回行った測定結果から, 泥質分のない堆積物

老

であれば、ガラスビーズの測定結果からわかるように SALD-3000Sと沈降管式粒度分析装置で、泥堆積物であ れば、SALD-3000Sと既存のレーザー回折式粒度分析装 置で精度の高い粒度分析測定が可能といえる.ただし、 測定時間はいずれの場合もSALD-3000Sの方が短い.

今回の測定で最も慎重に考えなければならないのは, 泥質砂の測定結果である.結論からいえば,この試料の 場合,SALD-3000S以外の測定値は信頼性が低いといえ る.もし,SALD-3000Sを使わないならば,泥質部と砂 質部をあらかじめ分離しておき,それぞれを別々の方法 (泥質部は既存のレーザー回折式粒度分析装置,砂質部 は篩か沈降管式粒度分析装置)で測定しおいて「つなぎ 合せ」作業を行うしかない.既に述べているように「つ なぎ合せ」作業では精度が落ちてしまう.

沈降管式粒度分析装置の問題点は次のようにいえる. この装置の場合,試料投与用の円盤(詳しくは田村・中 山(1993)参照)に試料を付着させる段階で,粒径偏在 をしないようにさせることが難しい.その上,沈降粒子 の集団効果により細粒子が単粒子沈降時に比較して大き な沈降速度を持つこともある(これは,軽く丸めた ティッシュを載せた本を手に持ち,適当な高さから手放 してみるとよく理解できる.ティッシュは本と等しい速 度で落下する).今回の測定で得られた平均粒径は「粒 径が最頻出するモード径にいくらかの細粒部のバイアス のかかった値」といった定性的な評価しか与えられない のである.立ち戻って考えるならば,そもそも沈降管式 粒度分析装置は Gibbs 式(Gibbs et al., 1971)をインス トールしてあり,泥の様な細粒子の測定はできないので ある.

一方, 0.1~192 µm を測定範囲とする既存のレーザー 回折式粒度分析装置では, 192 µm 以上の粒子を 192 µm と読み取ってしまうため測定結果が真の値を現さなく なっている. さらに、この装置については以前からポン プモータの出力の問題があり,実質的に数十μmより大 きな粒子の測定はかなり難しかった。その問題とは、ポ ンプの出力が小さくて数十 µm より大きな粒子をそれよ り細粒な粒子と均質を保って循環させることができない という問題である. 試料セルに投与した試料が適当な濃 度である時は、このことはあまり問題にせず測定でき る.しかし,試料投与が多量で高濃度となった時,一部 排水して水を加えて濃度を薄くすると、細粒部が選択的 に流れ落ちてしまうのである. さらに、ポンプ出力が小 さいため洗浄回数を多くしなければ数十 µm 以上の大粒 子を排出できないという問題もあった.ちなみに, SALD-3000S では、ポンプを最大出力にした場合、径2 mmのガラスビーズも他の試料の時と同じように3~4 回の洗浄で(モニタを見る限り)完全に洗い流すことが できた.

以上からして, SALD-3000S は, いかなる泥・砂試料 であっても十分な精度を持って粒度分析測定を行える装 置と判断できる.繰り返しになるが, SALD-3000S の最 大の特徴は, その測定可能な粒子径の範囲が 0.08~3000 µm と極めて広いこである.

### 2. ユーザーからみた改善が望まれる点

現段階は本装置を導入した直後であり,測定もあまり 多く行っていない.しかし,これまでの測定においても ユーザー(測定者)側からみたいくつかの改善が望まれ る点があるので,以下に示しておく.

第1にソフトウエアについてである.導入した装置に は「Wing-1~Wing-3」までが入っている「WingSALD-3000S DX」がインストールされている. これで, 測定 は十分に行えるが、図表表現が論文に添付する図にまで は対応できない.その例については、第5図の説明にも 一部示した.その他にも,2次元表現での多元処理した 場合に各累積曲線に白黒印刷でも認識しやすいよう線の 種類を破線や点線に変換したくなるわけであるが、それ にも対応していない.メーカー側からすれば、市販ソフ トにペーストして処理してもらいたいといったところか と理解できる. 乾式測定用ソフトも含めてソフトウエア は決して安価なものではない.確かに販売できる数が限 定されているが、よりレベルの高いソフトを期待してや まない. さらに,現在, SALD-3000S には英語バージョ ンが準備されていない. これも早期に解決してもらいた い問題である.

第2にハードの問題である.この報告に示したように 液体媒体で測定している限りにおいては,大変に便利な 装置である.しかし,これを乾式ユニットにして測定し ようとすると大変に苦労する.それは,乾式ユニット用 の部品の取り替える時(特に湿式の試料セルを乾式測定 ボックスに取り替える時),止め具などの扱いが難しい ことにある.これは,単純なハードのレイアウトで克服 できる点が多いと判断できる.乾式ユニットを重視しな い製品開発であったのではないかと疑わしくなることも ある.

第3は本装置による測定を正式な分析規格として認定 されるようメーカー側にも努力を望む点である.これに ついては私も含めて研究者も努力しなければならないの かもしれない.

第4はやはり価格の問題である.ソフトウエアのとこ ろでも述べたが、本装置をフルセットで購入するにはか なりの予算を要する.もっと安価になり、より広い分野 で使用されるようになると第3の問題も解決されていく のではないかと考える.

以上,ユーザーからみた改善点も述べたが,いずれに しても本装置がこれまでの粒度分析装置に比較して優れ ていることは明らかである.

## 文 献

- Agrawal, Y. C., McCave, I. N. and Riley, J. B., 1991, Laser diffraction size analysis. In: Syvitski, J. P. M. (ed.) *Principles, Methods and Application of Particle Size Analysis*. Cambridge Univ. Press, 119–128.
- Gibbs, R. J., Matthews, M. D. and Link, D. A., 1971, The relationship between sphere size and settling velocity. *Jour. Sed. Petrol.*, 41, 7–18.
- 伊勢屋ふじこ, 1985, 沈降式粒度分析の手引き. 筑波大 学水理実験センター報告, 9,115-128.

- 岸誠一・公文富士夫, 1993, 沈降天秤法と比重計法の組 み合わせによる泥質砂堆積物の粒度分析法.堆積学研 究会報, 38, 101-106.
- Komar, P. D. and Cui, B., 1984, The analysis of grain-size measurements by sieving and settling-tube techniques. *Jour. Sed. Petrol.*, 54, 603-614.
- 公文富士夫, 1990, 泥質堆積物の粒度分析における超音 波篩分析と比重計法の比較.堆積学研究会報, 33, 57-61.
- 公文富士夫・志岐常正, 1998,機器分析による粒度測定. 公文富士夫・立石雅昭編,新版砕屑物の研究法.地学 双書, 29, 308-314.
- 田村嘉之・中山勝博, 1993, 沈降式粒度分析装置の使用 法と分析結果の特徴.島根大学地質学研究報告, 12, 17-22.

(受付:1998年10月12日,受理:1998年10月20日)